

★ディペンダブルコンピューティング研究会 (DC)

専門委員長 金川信康 副委員長 井上美智子

幹事 岩田浩司・吉村正義

日時 6月16日(火) 14:10~16:50

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 高信頼性設計/テスト, 一般

1. BASTにおけるスキャンスライスに基づくテストデータ量削減法

○錦織 誠・山崎紘史・細川利典(日大)・吉村正義(京都産大)・新井雅之(日大)

2. クリティカルエリアに基づくブリッジ故障テスト生成の高速化に関する一検討

○新井雅之(日大)・犬山慎吾・岩崎一彦(首都大東京)

3. レイアウトデータを用いたテスト時の高消費電力エリア特定手法に関する研究

○宮瀬紘平(九工大)・ザウアー マティアス・ベッカー ベルンド(フライブルク大)・温 暁青・梶原誠司(九工大)

4. ラッチを用いた非同期式パイプライン回路の機能テストに関する一検討

豊嶋太樹・寺山恭平・黒川 敦・○今井 雅(弘前大)

5. マルチコアシステムにおける信頼度向上手法のマルコフモデルによる性能評価

○今井 雅(弘前大)・米田友洋(NII)

6. ソフトウェアテスト用テストケース生成における2分決定図を用いた制約処理 土屋達弘(阪大)

【問合先】

土屋達弘(阪大大学院情報科学研究科)

E-mail: t-tutiya@ist.osaka-u.ac.jp

◎最新情報は, DC 研究会ホームページを御覧下さい.

<http://www.ieice.org/iss/dc/jpn/index.html>